

MET JEOL 2100F

- TEM 120, 160, 200 kV.
Résolution point 0,23 nm
résolution ligne 0,1 nm
- STEM-HAADF
résolution 0,19 nm
- Tomographie (tilt jusqu'à 80°)
- SDD Oxford X-Max 80 mm²

Accessoires :

- Porte-objet high tilt pour tomographie
- Porte-objet microanalyse double tilt

